

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

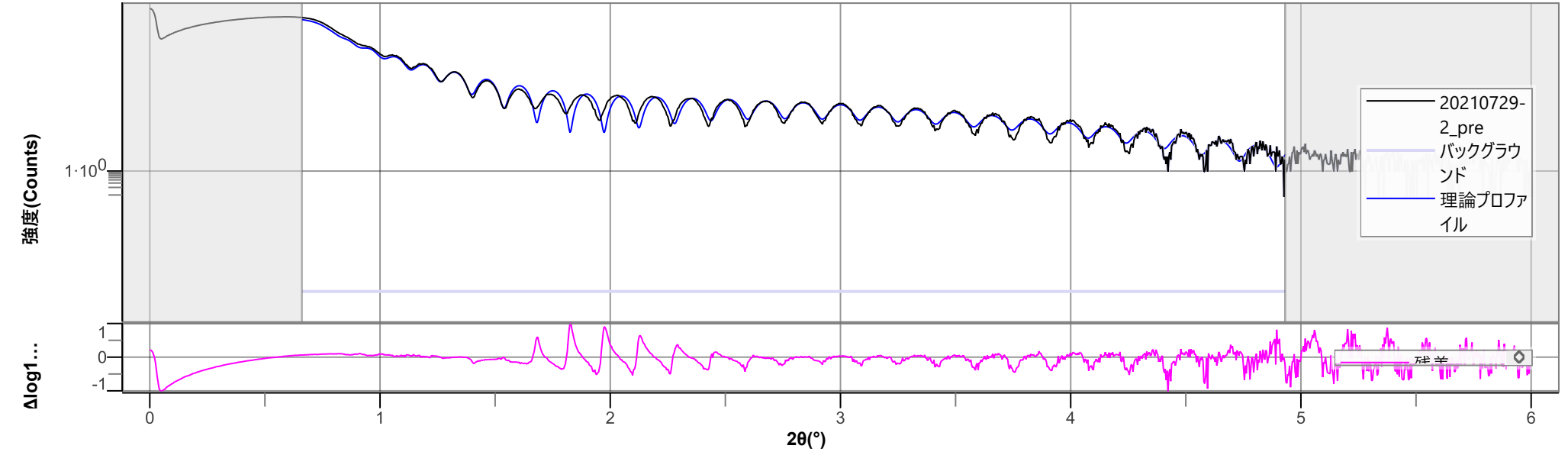
波長(nm): 0.1540593
点数: 1501
2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: なし

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	2.603	Const	5.28278	Const	0.314	Con...	
				±0.017	精密化	±0.02	精密化	±0.004	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	50.460	Const	7.56766	Const	0.354	Con...	
				±0.03	精密化	±0.02	一最大 精密化	±0.013	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	